

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

G/TBT/2/Add.19

2 de agosto de 1996

(96-3096)

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio

Original: inglés

APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO SOBRE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO

Se ha recibido de la delegación de Bahrein la siguiente declaración, presentada en virtud del párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo.

1. El Gobierno de Bahrein está constituyendo una comisión nacional que se ocupará de todas las cuestiones relativas a los Acuerdos de la OMC y de su coordinación, incluida la aplicación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.
2. Las normas nacionales de Bahrein son de aplicación obligatoria, mientras que los reglamentos técnicos, que suelen ser elaborados por departamentos gubernamentales, no se consideran nacionales hasta que se adoptan como normas nacionales.
3. Casi todas las normas de Bahrein se basan en las normas de los países del Golfo, elaboradas por la Organización de Normalización y Metrología del CCG.
4. Las normas de Bahrein se publican en la Gaceta Oficial y normalmente entran en vigor a los seis meses de su publicación.
5. Todos los departamentos gubernamentales que elaboran reglamentos técnicos, aunque sea para su uso interno, han de estar informados acerca de las disposiciones del Acuerdo y deben notificar los reglamentos a la Dirección de Normas y Metrología.
6. La Dirección de Normas y Metrología del Ministerio de Comercio es el servicio de información y se encarga de elaborar las notificaciones y publicarlas en la Gaceta Oficial y en el Boletín de la Dirección de Normas y Metrología. La dirección de este servicio es la siguiente:

Directorate of Standards and Metrology
Ministry of Commerce
P.O. Box 5479
Manama
Bahrein
7. La Dirección de Relaciones Comerciales Exteriores del Ministerio de Comercio es el servicio competente a efectos de consultas de conformidad con el Acuerdo.
8. Los proyectos de normas elaborados a nivel nacional y regional han de ser publicados en la Gaceta Oficial y en el Boletín de la Dirección de Normas y Metrología.